



**Международная конференция
Сканирующая Зондовая Микроскопия – 2017
(Scanning Probe Microscopy – 2017)**

28 – 30 августа 2017 г.

Молодежная конференция

«Применение зондовой микроскопии в научных исследованиях»

27 – 30 августа 2017 г.

Уральский федеральный университет, Екатеринбург

Цель конференции:

Конференция будет посвящена широкому кругу вопросов, связанных с современным состоянием и перспективами развития различных методов Сканирующей Зондовой микроскопии (СЗМ) в различных областях науки. Молодежная конференция будет включать приглашенные лекции ведущих специалистов и практические занятия на оборудовании УЦКП «Современные нанотехнологии» ИЕНиМ УрФУ. Будет проведен конкурс работ молодых ученых.

Конференция планируется быть первой в цикле ежегодных конференций, проводимых в разных городах России.

Тематики конференции:

1. СЗМ в материаловедении
2. Новые методы СЗМ
3. СЗМ в биологии и медицине
4. Аналитические методы СЗМ
5. Зондовая литография
6. In situ возможности СЗМ
7. Обработка данных СЗМ
8. Сканирующая микроскопия пьезоотклика

Программный комитет:

А.А. Бухараев	КФТИ КазНЦ РАН, Казань	В.Я. Шур	УрФУ, Екатеринбург
В.А. Быков	NT-MDT SI, Зеленоград	И.В. Яминский	МГУ, Москва
А.В. Латышев	ИФП СО РАН, Новосибирск	А.Л. Груверман	Университет Небраски, США
В.Л. Миронов	ИФМ РАН, Нижний Новгород	А.П. Володин	Университет Левен, Бельгия
Г.М. Михайлов	ИПТМ РАН, Черноголовка	А.Л. Холкин	Университет Авейру, Португалия
А.А. Саранин	ИАПУ ДО РАН, Владивосток	С.А. Чижик	ИТМО НАНБ, Минск, Беларусь

Сопредседатели конференции:

В.Я. Шур и В.Л. Миронов

Официальный web-сайт конференции:

<http://nanocenter.urfu.ru/ru/SPM2017>

Официальные языки конференции:

русский и английский

Генеральный спонсор конференции:

холдинг NT-MDT Spectrum Instruments

Труды конференции планируется опубликовать в реферируемых журналах

Важные даты:

Начало регистрации на сайте: 01 марта 2017 г.
Окончание принятия тезисов: 15 апреля 2017 г.

Контакты:

тел./факс: (343) 261 74 36
spm-2017@labfer.ru

